

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ||

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ||
2017-2018 BAHAR DÖNEMİ ||

LİSANS TEZİ BİTİRME PROJESİ ||

KONU ||
İLETİM HATLARINDA EMPEDANS TABANLI ARIZA YERİ TESPİTİ
İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM ||

5,2 cm

HASAN GEZER
MİRZA DURU
HASAN KAHVECİ

5,2 cm

Prof.Dr. Nevcihan Duru

Danışman, Kocaeli Üniv.

Doç.Dr. Sevinç İLHAN OMURCA

Jüri Üyesi, Kocaeli Üniv.

Dr. Öğr. Üyesi Orhan AKBULUT

Jüri Üyesi, Kocaeli Üniv.

||

Tezin Savunulduğu Tarih: 01.06.2018 ||

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR

Bu tez
çalışması,.....a
macıyla gerçekleştirilmiştir.

Tez çalışmamda desteğini esirgemeyen, çalışmalarına yön veren, bana güvenen ve
yüreklendiren danışmanım sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Tez çalışmamın tüm aşamalarında bilgi ve destekleriyle katkıda bulunan
hocam..... teşekkür ediyorum.

Tez çalışmamda gösterdiği anlayış ve destek için sayın..... teşekkürlerimi
sunarım.

Hayatım boyunca bana güç veren en büyük destekçilerim, her aşamada sıkıntılarımı ve
mutluluklarımı paylaşan sevgili aileme teşekkürlerimi sunarım.

Mayıs – 2018

Ali EKEN, Mirza DURU, Hasan KAHVECİ

Bu dokümandaki tüm bilgiler, etik ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilip sunulmuştur. Ayrıca yine bu kurallar çerçevesinde kendime ait olmayan ve kendimin üretmediği ve başka kaynaklardan elde edilen bilgiler ve materyaller (text, resim, şekil, tablo vb.) gerekli şekilde referans edilmiş ve dokümanda belirtilmiştir. ||

Öğrenci No: 170201025

Adı Soyadı: Ali EKEN

Öğrenci No: 170201003

Adı Soyadı: Mirza DURU

Öğrenci No: 160201193

Adı Soyadı: Hasan KAHVECİ ||

Öğrenciler : 170201025 Ali EKEN , 170201003 Hasan KAHVECİ , 160201193 Hasan KAHVECİ .

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR	i
İÇİNDEKİLER	ii
ŞEKİLLER DİZİNİ	iii
TABLolar DİZİNİ	iv
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ	v
OZET	vii
ABSTRACT	viii
GİRİŞ	1
1. SAYISAL KORUMADA TEMEL KAVRAMLAR	3
1.1. Ayrık İşaretlerin Fazörel Gösterimi	3
1.2. Arıza Tipinin Belirlenmesi	6
2. İLETİM HATLARINDA EMPEDANSA DAYALI ARIZA YERİ BULMA ALGORİTMALARI	12
2.1. Tek Bara Ölçümlerini Kullanan Arıza Yeri Bulma Algoritmaları	13
2.1.1. Basit reaktans algoritması	13
2.1.2. Takagi algoritması	13
2.1.3. Geliştirilmiş Takagi algoritması	14
2.2. İki Bara Ölçümlerini Kullanan Arıza Yeri Bulma Algoritmaları	14
2.1.1. Basit arıza gerilimi eşitliği algoritması	14
2.1.2. Asimetrik arıza yeri bulma algoritması	15
2.1.3. Negatif bileşenler ile arıza yeri bulma algoritması	16
2.1.4. Simetrik arıza yeri bulma algoritması	17
3. EMPEDANSA DAYALI ARIZA YERİ BULMA ALGORİTMALARININ FARKLI TEST SİSTEMLERİNDE UYGULANMASI	20
3.1. Homojen Test Sistemi	20
3.2. Homojen Olmayan Test Sistemi	24
3.3. Homojen Olmayan Test Sistemi (Orta Uzun Hat Modeli - Pi Eşdeğer Devresi)	28
4. SERİ KAPASİTÖRLÜ İLETİM HATLARINDA ARIZA YERİ TESPİTİ	33
5. SERİ KAPASİTÖRLÜ İLETİM HATLARI İÇİN PERFORMANSA DAYALI ARIZA YERİ BULMA ALGORİTMASI	37
5.1. Algoritmanın Temel Arıza Yeri Bulma Algoritmaları İle Karşılaştırması	41
5.2. Seri Kapasitörlü İletim Hatlarını Baz Alan Arıza Yeri Bulma Algoritmalarının Karşılaştırılması	45
6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER	48
KAYNAKLAR	53
EKLER	59
KİŞİSEL YAYIN VE ESERLER	68
ÖZGEÇMİŞ	69
ŞEKİLLER DİZİNİ	

Şekil 1.1.	Yinelenen Fourier ifadesi	5
Şekil 1.2.	Simetrik bileşenlerin gösterimi a) pozitif bileşenler b) negatif bileşenler c) sıfır bileşenler	7
Şekil 1.3.	Şebekenin a) pozitif bileşen devresi b) negatif bileşen devresi c) sıfır bileşen devresi	8
Şekil 1.4.	Arıza öncesi, arıza anı ve arıza sonrası durum	9
Şekil 2.1.	İletim hattında arıza eşdeğer devresi	12
Şekil 3.1.	Homojen test sistemi	20
Şekil 3.2.	Homojen olmayan test sistemi	24
Şekil 3.3.	Homojen olmayan test sistemi(π modeli)	28
Şekil 5.1.	Seri kapasitörlü iletim hattı	37
Şekil 5.2.	Arıza yerinin S barası ve seri kapasitör arasında olma durumu	38
Şekil 5.3.	Performansa dayalı alınan algoritmanın akış diyagramı	41
Şekil 5.4.	Seri kapasitörlü test sistemi	42
Şekil 5.5.	MOV ve seri kapasitörde ki akım değişimi	43

TABLÖLAR DİZİNİ

Tablo 1.1. Arıza tiplerine göre pozitif bileşen empedans eşitlikleri	10
Tablo 3.1. Homojen test sisteminde farklı uzaklıklardaki çeşitli arıza tipleri için yüzde hata oranları	21
Tablo 3.2. Homojen test sisteminde farklı arıza dirençlerindeki çeşitli arıza tipleri için yüzde hata oranları	23
Tablo 3.3. Homojen olmayan test sisteminde farklı uzaklıklardaki çeşitli arıza tipleri için yüzde hata oranları	25
Tablo 3.4. Homojen olmayan test sisteminde farklı arıza dirençlerindeki çeşitli arıza tipleri için yüzde hata oranları	26
Tablo 3.5. Homojen olmayan test sisteminde (orta uzun hat modeli - π eşdeğer devresi) farklı uzaklıklardaki farklı arıza tipleri için yüzde hata oranları	29
Tablo 3.6. Homojen olmayan π eşdeğer devreli test sisteminde farklı arıza dirençlerindeki çeşitli arıza tipleri için yüzde hata oranları	30
Tablo 4.1. Seri kompanzasyonun etkileri ve sonuçları	33
Tablo 4.2. Seri kompanze edilmiş iletim sistemleri için kullanılan bazı algoritmalar ve özellikleri	34
Tablo 5.1. Test sistemi parametreleri	42
Tablo 5.2. Test sisteminin simülasyon parametreleri	42
Tablo 5.3. Test sisteminin farklı uzaklıklardaki çeşitli arıza tipleri için yüzde hata oranları	44
Tablo 5.4. Test sisteminin farklı arıza dirençlerindeki faz-faz-toprak arıza tipi için yüzde hata oranları	45
Tablo 5.5. Seri kapasitörü dikkate alan algoritmaların karşılaştırılması	46
Tablo 5.6. Seri kapasitörü dikkate alan algoritmaların genel özellikleri	47

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

$\alpha_{1,2,3}$: Eğim için alınan açı, (°)
φ	: Aç, (°)
θ	: Aç, (rad)
d	: Arıza noktasının referans baraya uzaklığı, (%)
d_{capS}	: Seri kapasitörün S barasına uzaklığı, (%)
d_{capR}	: Seri kapasitörün R barasına uzaklığı, (%)
d_S	: Arıza noktasının S barasına uzaklığı, (%)
d_R	: Arıza noktasının R barasına uzaklığı, (%)
f_0	: İşaretin frekansı, (Hz)
f_s	: Örnekleme frekansı, (Hz)
I^0	: Sıfır bileşen akımı, (A)
I^1	: Pozitif bileşen akımı, (A)
I^2	: Negatif bileşen akımı, (A)
I_a	: a fazı akımı, (A)
I_{ab}	: a fazı ve b fazı akımları farkı, (A)
I_b	: b fazı akımı, (A)
I_{bc}	: b fazı ve c fazı akımları farkı, (A)
I_c	: c fazı akımı, (A)
I_{ca}	: c fazı ve a fazı akımları farkı, (A)
I_{cap}	: Seri kapasitör üzerinden geçen akım, (A)
I_F	: Arıza noktasından geçen akım, (A)
I_{FR}	: Arıza noktasından geçen akımın R barasından gelen kısmı, (A)
I_{FS}	: Arıza noktasından geçen akımın S barasından gelen kısmı, (A)
$I_{önce}$: Arıza öncesi akım, (A)
I_R	: R barasından çıkan akımı, (A)
I_{ref}	: Alınan referans akım, (A)
I_S	: S barasından çıkan akımı, (A)
$I_{süp}$: Süperpozisyon akımı, (A)
$I_{süp}^*$: Süperpozisyon akımının eşleniği, (A)
R_F	: Arıza noktası empedansı, (Ω)
X_L	: Hat empedansının imajiner bileşeni, (Ω)
x_d''	: Senkron makinenin subtransientreaktansı, (pu)
V^0	: Sıfır bileşen gerilimi, (V)
V^1	: Pozitif bileşen gerilimi, (V)
V^2	: Negatif bileşen gerilimi, (V)
V_a	: a fazı gerilimi, (V)
V_{ab}	: a fazı ve b fazı gerilimleri farkı, (V)
V_b	: b fazı gerilimi, (V)
V_{bc}	: b fazı ve c fazı gerilimleri farkı, (V)
V_c	: c fazı gerilimi, (V)
V_{ca}	: c fazı ve a fazı gerilimleri farkı, (V)
V_{cap}	: Kapasitör öncesindeki bağlantı noktasının gerilimi, (V)
V_R	: R barası (uzak bara) gerilimi, (V)
V_{ref}	: Alınan referans gerilimi, (V)

V_S	: S barası (yakın/referans bara) gerilimi, (V)
V_F	: Arıza noktası gerilimi, (V)
Z_{Cap-F}	: Seri kapasitör ile arıza noktası arasındaki empedans, (Ω)
Z_L	: Hat empedansı, (Ω)
Z_R	: R barasından görülen thevenin empedansı, (Ω)
Z_S	: S barasından görülen thevenin empedansı, (Ω)

Kısaltmalar

AC	: AlternativeCurrent (Alternatif Akım)
ANN	: ArtificialNeural Networks (Yapay Sinir Ağları)
DDA	: DeterministicDifferentialApproach (Deterministik Diferansiyel Yaklaşım)
FACTS	: FlexibleAlternativeCurrentTransmissionSystem (Esnek Alternatif Akım İletim Sistemi)
IEEE	: TheInstitute of ElectricalandElectronicsEngineers (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü)
Im	: İmajiner
min	: Minimum
MOV	: Metal OxideVaristor (Metal Oksit Varistör)
PMU	: PhasorMeasurementUnit (Fazör Ölçüm Ünitesi)
R	: Receiving (Alan)
Re	: Reel
S	: Sending (Gönderen)
SC	: Series Capacitor (Seri Kapasitör)

İLETİM HATLARINDA EMPEDANS TABANLI ARIZA YERİ TESPİTİ İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM ||

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, iletim hatlarında arıza yeri tespiti için empedansa dayalı algoritmaları incelemek ve seri kompanze edilmiş hatlar için yeni bir algoritma geliştirmektir.

Öncelikle, tek yada iki baradan alınan ölçümleri kullanarak arıza yerini belirleyen temel algoritmalar tanımlanmıştır. Örnek test sistemleri üzerinde sistem ve arızaya ilişkin parametreler değiştirilerek, temel arıza yeri algoritmalarından elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Sistem parametreleri hat modeli ve sistemin homojen olup olmama durumlarını kapsarken, arızaya ilişkin parametreler arıza tipi, konumu ve direnci olarak alınmıştır.

Seri kompanze edilmiş iletim hatlarında empedansa dayalı geliştirilmiş temel algoritmaların yeterli olmadığı, bu duruma özel algoritmaların gerekliliği bir uygulama ile gösterilmiştir. Bu özel algoritmalar incelenerek kısaca özetlenmiştir. Buradan hareketle, iletim hatlarında seri kompanzasyon durumunu dikkate alan performansa dayalı yeni bir arıza yeri tespiti algoritması bu tez kapsamında geliştirilmiştir.

Geliştirilen bu algoritma, hat bilgileri ve iki baradan alınan ölçümleri kullanarak iteratif olarak arıza yerini hesaplayan, bütün örneklerdeki sonuçları karşılaştırarak minimum hata ile bir sonuca ulaşan bir algoritmadır. Önerilen algoritma, hem temel algoritmalar hem de seri kompanze edilmiş iletim hatları için tasarlanmış, iki farklı algoritma türü ile çeşitli test sistemleri üzerinde denenmiş, alınan sonuçlar karşılaştırılmıştır. Test sistemleri DigSILENT üzerinde modellenmiş ve kısadevre analizleri yapılmış olup, bu sistemden alınan akım ve gerilim bilgileri MATLAB ortamında kodlanan algoritmalar için kullanılmıştır. ||

Anahtar kelimeler: Arıza Yeri Bulma Algoritmaları, İletim Hatları, MOV, PMU, Seri Kapasitör.